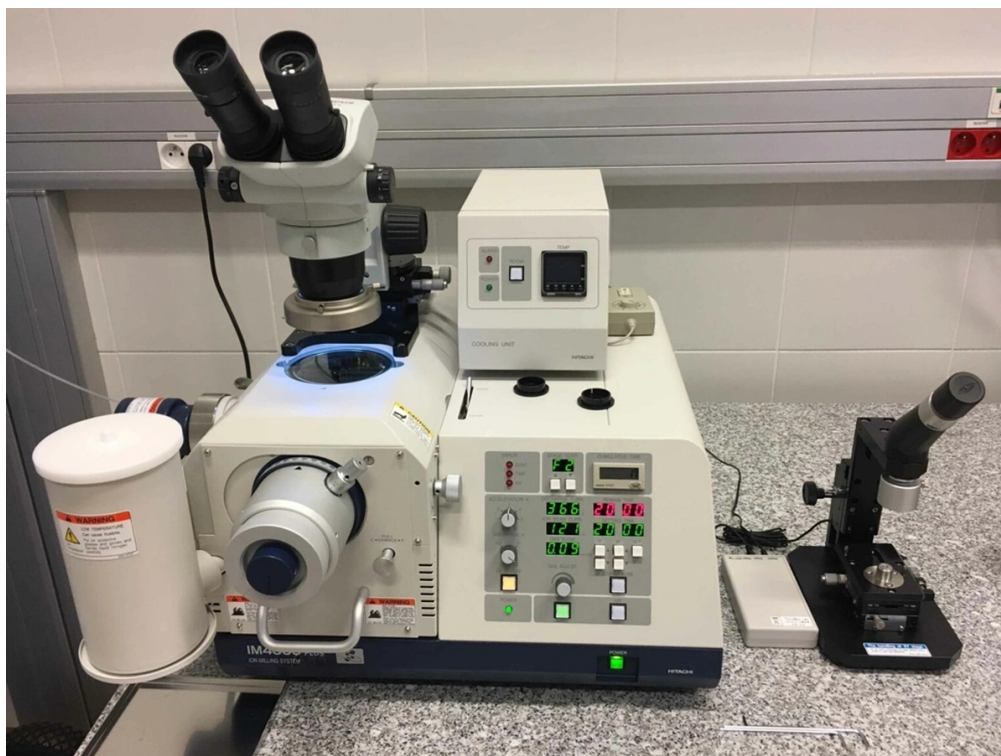


Zestaw do polerowania jonowego powierzchni płaskich oraz wykonywania przekrojów poprzecznych ciał stałych



Opis techniczny:

Polerka jonowa jest urządzeniem służącym do precyzyjnego polerowania powierzchni płaskich jak również do wykonywania przekrojów poprzecznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów. Urządzenie umożliwia pracę z próbkami o średnicy dochodzącej do 50 mm przy energiach jonów do 6 keV. Na wyposażeniu jest również w układ chłodzenia ciekłym azotem, co umożliwia wykonywanie zglądów poprzecznych materiałów czułych na podwyższoną temperaturę (np. polimerów).

Polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. W szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zglądów metalograficznych przeznaczonych do analizy EBSD.

Nazwa handlowa: Polerka jonowa Hitachi IM4000Plus

Więcej szczegółów: </equipment/zestaw-do-polerowania-jonowego-powierzchni-paskich/>

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Tokarski Tomasz

Osoba kontaktowa - adres strony www: <https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html>

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespół: Zakład Inżynierii Materiałowej

Data ostatniej aktualizacji: 28 listopada 2024 10:50

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2017

Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Możliwości badawcze:

Polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. W szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zglądów metalograficznych przeznaczonych do analizy EBSD.

Możliwości pomiarowe:

Podstawowe parametry urządzenia.

Napięcie przyspieszające:

0-6 kV Średnica wiązki jonów: do 400 um

Kąt polerowania: 0-90 stopni

Powierzchnie płaskie. Maksymalne wymiary próbki: średnica do 50 mm, wysokość do 30 mm

Przekroje poprzeczne. Wymiary próbki: do 20x13x9 mm Szybkość cięcia: 0,5 mm/h dla Si Opcja chłodzenie

Warunki udostępniania infrastruktury:

Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (<https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/>)